

<<数字系统测试与可测试设计>>

图书基本信息

书名：<<数字系统测试与可测试设计>>

13位ISBN编号：9787111192374

10位ISBN编号：7111192370

出版时间：2006-8

出版时间：机械工业出版社

作者：阿布拉莫韦奇

页数：449

译者：李华伟

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<数字系统测试与可测试设计>>

### 内容概要

本书系统地介绍数字系统测试理论和方法，包括测试生成、故障模型、故障模拟、可测试性设计、内建自测试等内容。

本书共分为三部分：第一部分介绍数字系统、数字微系统芯片缺陷的来源、逻辑描述的方法等；第二部分介绍数字系统的可测试性设计理论和方法、内建自测试BIST、测试数据压缩方法等；第三部分主要讨论系统测试的方法。

本书概念清晰、层次分明、定义和证明准确、算法推导和阐述简练。

每章附有大量练习题可帮助读者消化吸收所学的概念。

本书可供数字系统设计相关技术人员参考，也可作为高等院校相关专业高年级本科生或研究生的教材。

## <<数字系统测试与可测试设计>>

### 作者简介

李华伟：中国科学院计算机研究所副研究员，选进测试技术实验室副主任，博士生导师。  
1996年在湘潭大学计算机科学系获学士学位。  
1999年和2001年分别在中科院计算技术研究所获硕士学位和博士学位。  
主要研究领域为集成电路测试，在国内外刊物和国际学术会议上发表论文60余篇，授

## &lt;&lt;数字系统测试与可测试设计&gt;&gt;

## 书籍目录

译者序译者简介中文版前言前言本书是如何写出来的第1章 绪论第2章 建模 2.1 基本概念 2.2 逻辑级的功能建模 2.3 寄存器级的功能建模 2.4 结构模型 2.5 建模的层次 参考文献 习题第3章 逻辑模拟 3.1 应用 3.2 基于模拟设计验证中的问题 3.3 模拟的类型 3.4 未知的逻辑值 3.5 编译后模拟 3.6 事件驱动模拟 3.7 叶延模型 3.8 元件求值 3.9 冒险检测 3.10 门级事件驱动模拟 3.11 模拟引擎 参考文献 习题第4章 故障模型 4.1 逻辑故障模型 4.2 故障检测和冗余 4.3 故障等价和故障定位 4.4 故障支配 4.5 单固定型故障模型 4.6 多固定型故障模型 4.7 固定的RTL变量 4.8 故障变量 参考文献 习题第5章 故障模拟 5.1 应用 5.2 通用故障模拟技术 5.3 组合电路的故障模拟 5.4 故障采样 5.5 统计故障分析 5.6 本章小结 参考文献 习题第6章 单固定型故障测试 6.1 基本问题 6.2 组合电路中的单固定型故障的自动测试生成 6.3 时序电路SSF的ATC 6.4 本章小结 参考文献 习题第7章 桥接故障测试 7.1 桥接故障模型 7.2 无反馈桥接故障的检测 7.3 桥接故障的检测 7.4 桥接故障模拟 7.5 桥接故障的测试生成 7.6 本章小结 参考文献 习题第8章 功能测试.....第9章 可测试性设计第10章 测试压缩技术第11章 内建自测试第12章 逻辑级诊断第13章 自校验设计第14章 PLA测试第15章 系统级诊断索引

<<数字系统测试与可测试设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>